рамки, отстоящих друг от друга на $(2m+1)\lambda/2$; при этом две другие стороны отстоят друг от друга на расстояние $m\lambda$. В результате получается диаграмма направленности, аналогичная представленной на рис. 4.



Рис. 4

Выводы

На примерах электрической и магнитной антенн показано, что радиосвязь осуществляется за счет динамического взаимодействия электрических зарядов электронов и протонов материала передающей и приемной антенн. Найденные соотношения для силы взаимодействия приемной и передающей антенн совпадают с эмпирическими соотношениями, применяемыми на практике.

Предложено учитывать при расчетах цепей заряды протонов материала антенны, что представляет методический интерес и может найти применение как в научных исследованиях, так и в инженерной практике.

Автор благодарит Ю. А. Пирогова за ценные замечания и полезное обсуждение.

ЛИТЕРАТУРА

[1] Максвелл Д. К. Избранные сочинения по теории электромагнитногополя. М., 1954. [2] Айзенберг Г. З. Антенны для магистральных коротковолновых радиосвязей. М. 1948. [3] Проблемы антенной техники/Под ред. Л. Д. Бахраха и Д. И. Воскресенского. М., 1989. [4]. Томилин Е. Ф.//Изв. АН СССР, Физика Земли. 1992. № 10. С. 113. [5] Шулейкин М. В. Курс радиотехники. Ч. 1: Распространение электромагнитной энертии. Вып. 1, 2. М., 1923.

> Поступила в редакцию-13/12.93

ВЕСТН. МОСК. УН-ТА. СЕР. 3, ФИЗИКА. АСТРОНОМИЯ. 1994. Т. 35, № 5

АКУСТИКА И МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА

УДК 534.26

К ТЕОРИИ КОНФОКАЛЬНОГО ОПТИКО-АКУСТИЧЕСКОГО МИКРОСКОПА.

А. А. Карабутов, В. В. Клевицкий, М. А. Мусаев, С. Ф. Османов (кафедра общей физики и волновых процессов)

Анализируется работа оптико-акустического микроскопа с фокусированным приемником звука. Показано, что при непосредственной регистрации контраст во всем циапазоне частот определяется тепловым расширением поглощающей среды, а прикосвенной — теплообменом на поверхности. Планарное разрешение ограничивается допустимым нагревом поверхности и может достигать микронного уровня. Определена частота, на которой отношение «сигнал/шум» достигает максимума. Оптико-акустическая микроскопия в настоящее время находит все более широкое применение в задачах неразрушающего контроля, дефектоскопии и днагностики материалов и изделий в различных отраслях промышленности, таких как микроэлектроника [1], авиастроение [2], химическое машиностроение [3] и др. Она позволяет исследовать непрозрачные объекты, получать послойные картины неоднородностей, планарное разрешение при этом может достигать микронного уровня и определяться фокусировкой оптического излучения. Глубина зондирования и разрешение по глубине определяются частотой модуляции излучения и могут достигать долей микрона.

В традиционной схеме оптико-акустического микроскопа лазерное излучение, модулированное по периодическому закону, фокусируется на поверхность исследуемого объек-

на поверхность исследуемого объекта, который размещен на пьезоэлементе либо в газомикрофонной ячейке [4]. В этих случаях колебания любой точки поверхности могут давать вклад в сигнал, и поэтому фоновая составляющая может быть велика. Более оптимальным представляется использование фокусированного приемника звука, расположенного так, чтобы фокусы оптической и акустической систем совпадали. Такая схема была реализована в [5] при косвенной регистрации сигнала в воздухе фокусированным пьезоприемником. В настоящей работе теоретически анализируется предельная разрешающая способность конфокального оптико-акустического микроскопа как при косвенной, так и при непосредственной регистрации.

Пусть сфокусированный лазерный луч (рис. 1) падает нормально на поверхность z=0 раздела поглощающей (2) и прозрачной (1) сред,



Рис. 1. Конфокальный оптико-акустический микроскоп: 1— прозрачная среда, 2— поглощающая среда, 3— фокусированное излучение, 4— микрофонный приемник для косвенной регистрации, 5 пьезоприемник для непосредственной регистрации

и распределение интенсивности света в поглощающей среде $I(\mathbf{r}, t)$ может быть описано выражением

$$I(\mathbf{r}, t) = (1 - R) I_{S} f(t) H(\mathbf{r}_{\perp}) g(z).$$

Здесь f(t) — функция модуляции интенсивности света, $H(\mathbf{r}_{\perp})$ — распределение интенсивности света по сечению пучка, R — коэффициент отражения света, g(z) описывает распределение интенсивности света по глубине. При постоянном коэффициенте поглощения света α функция g(z) пропорциональна $\exp(-\alpha z)$. Считается, что длина перетяжки значительно больше глубины проникновения света α^{-1} . Главную ось акустической системы приемника считаем совпадающей с осью z.

Тепловые поля в прозрачной (T_1) и поглощающей (T_2) средах, возбуждаемые при поглощении света, могут быть найдены из уравнений теплопроводности

$$\chi_1^{-1} \partial T_1 / \partial t = \Delta T_1, \qquad z < 0, \qquad (2)$$

$$\chi_2^{-1} \partial T_2 / \partial t = \Delta T_2 - \kappa_2^{-1} \partial I / \partial z, \quad z > 0, \qquad (3)$$

(1)

и граничных условий непрерывности температуры и теплового потока

$$T_{1}|_{z=0} = T_{2}|_{z=0},$$

$$\kappa_{1}\partial T_{1}/\partial z|_{z=0} = \kappa_{2}\partial T_{2}/\partial z|_{z=0},$$

$$T_{1}(z \rightarrow -\infty) = T_{2}(z \rightarrow +\infty) = 0,$$
(6)

где и₁, и₂, χ₁, χ₂ — тепло- и температуропроводность сред. В типичном для оптико-акустической микроскопии случае и₁≪и₂.

Эти тепловые поля являются источниками акустических волн, возбуждение которых описывается уравнениями (см. [6])

$$c_{l1}^{-2}\partial^{2}\varphi_{1}/\partial t^{2} - \Delta\varphi_{1} = -\beta_{1}\partial T_{1}/\partial t, \qquad (7)$$

$$c_{l2}^{-2}\partial^{2}\varphi_{2}/\partial t^{2} - \Delta\varphi_{2} = -\beta_{2}^{*}\partial T_{2}/\partial t, \qquad (8)$$

$$c_{t2}^{-2}\partial^2 \psi_2 / \partial t^2 - \Delta \psi_2 = 0, \tag{9}$$

где φ_1 , φ_2 , ψ_2 — потенциалы колебательной скорости, β_1 — коэффициент теплового расширения прозрачной среды, $\beta_2^* = \beta_2 (1 - 4c^2_{12}/3c^2_{12})$ — эффективный коэффициент теплового расширения поглощающей среды.

Решение системы (1)—(6) удобно искать спектральным методом (см., напр., [6]):

$$\widetilde{T}_{1}(\omega, \mathbf{k}_{\perp}, z) = \int_{-\infty}^{\infty} \int dt d\mathbf{r}_{\perp} \exp \{i (\omega t - \mathbf{k}_{\perp} \mathbf{r}_{\perp})\} T_{1}(t, \mathbf{r}_{\perp}, z),$$

$$\widehat{T}_{2}(\omega, \mathbf{k}_{\perp}, p) = \int_{-\infty}^{\infty} \int dt d\mathbf{r}_{\perp} \int_{0}^{\infty} dz \exp \{i (\omega t - \mathbf{k}_{\perp} \mathbf{r}_{\perp}) - pz\} T_{2}(t, \mathbf{r}_{\perp}, z).$$

Переходя к спектральным амплитудам также и в уравнениях (7)—(9) с соответствующими граничными условиями, можно получить решение для потенциалов $\tilde{\varphi}_1$, $\hat{\varphi}_2$, $\hat{\psi}_2$ спектра колебательной скорости; ввиду его громоздкости оно не приводится. Решение имеет смысл рассматривать только в условиях адиабатического распространения акустических волн: $\omega \ll \omega_x = c^2 t_2/\chi$, что выполняется во всем ультразвуковом диапазоне частот вплоть до единиц гигагерц.

Анализ возбуждения звука при плоской геометрии задачи (что соответствует регистрации волн с k_{\perp} =0) был подробно проведен в [6, 7]. Однако при такой регистрации чувствительность акустической системы, очевидно, не максимальна. Поэтому уделим основное внимание фокусированным приемникам звука. С этой целью необходимо получить выражения для амплитуд акустических волн в дальней зоне, поскольку из-за острой фокусировки греющего излучения угловой спектр возбуждаемых акустических волн широкий. Вычисляя интегралы обратных преобразований Фурье и Лапласа методом стационарной фазы, можно получить для колебательной скорости v следующие выражения:

для косвенной регистрации

$$\widetilde{v}_{1}(\omega, r) = \frac{i\omega\beta_{1}\sqrt{\chi_{2}\chi_{1}}(1-R)I_{S}\widetilde{f}(\omega)\widetilde{H}(\omega\sin\theta/c_{l1})}{\varkappa_{2}c_{l1}} \times \frac{\exp(i\omega r/c_{l1})}{2\pi r}\widetilde{g}(-i\sqrt{i\omega/\chi_{2}});$$

(10)•

для непосредственной регистрации

$$\widetilde{v}_{2}(\omega, r) = \frac{i\omega\beta_{2}^{*}\chi_{2}(1-R)I_{S}\widetilde{f}(\omega)\widetilde{H}(\omega\sin\theta/c_{l_{2}})}{\kappa_{2}c_{l_{2}}} \times \frac{\exp(i\omega r/c_{l_{2}})}{2\pi r} \left\{ i\left[\widehat{g}(i\omega\cos\theta/c_{l_{2}})-V(\theta)\widehat{g}(-i\omega\cos\theta/c_{l_{2}})\right] + \left[\sqrt{i\omega\chi_{2}/c_{l_{2}}^{2}}\cos\theta(1+V(\theta))-\beta_{1}\rho_{1}\sqrt{\chi_{1}}/(\beta_{2}^{*}\rho_{2}\sqrt{\chi_{2}})W(\theta)\right] \times \widehat{g}(-i\sqrt{i\omega/\chi_{2}}) \right\}.$$
(11)

Здесь

$$V(\theta) = \frac{(n^2/2 - \sin^2 \theta)^2 - \sin^2 \theta \cdot \cos \theta \sqrt{n^2 - \sin^2 \theta}}{(n^2/2 - \sin^2 \theta)^2 + \sin^2 \theta \cdot \cos \theta \sqrt{n^2 - \sin^2 \theta}},$$

$$W(\theta) = (N^2 - \sin^2 \theta)^{-1/2} n^2 (n^2/2 - \sin^2 \theta) \cos \theta \times$$
(12).

$$\times \left[(n^2/2 - \sin^2\theta)^2 + \sin^2\theta \cos\theta \sqrt{n^2 - \sin^2\theta} \right]^{-1}, \tag{13}$$

где $n = c_{l_2}/c_{l_2}$, $N = c_{l_2}/c_{l_1}$. Зависимости коэффициентов V и W от угла θ показаны на рис. 2.

В формуле (11) первое слагаемое описывает возбуждение звука за счет поглощения света и теплового

расширения поглощающей среды [8----10] даже в отсутствие диффузии тепла, второе — возбуждение звука свободно диффундирующей в поглощающей среде тепловой волной и последнее — возбуждение звука за счет расширения теплового прозрачной среды. Сравнение этих вкладов при плоской геометрии задачи было проведено в [7]; поскольку при поверхностном поглощении света и свободной границе возбуждение звука в нормальном направлении неэффективно (см. рис. 2), на низких частотах основную роль в этом случае начинают играть



Рис. 2. Зависимость от угла θ коэффициентов $[1-V(\theta)]$ (1) и $W(\theta)$ (2) в формуле (11)

процессы диффузии тепла. В случае же фокусированного приемника, регистрирующего диапазоне ВОЛНЫ В широком vглов θ. существенный вклад направлениях вблизи дают волны в мак- $(\theta \approx 65^\circ)$. симума диаграммы направленности За счет этого R случае фокусированного приема во всем диапазоне частот преобладает слагаемое, соответствующее тепловому расширению поглощающей среды. Таким образом,

$$\widetilde{v}_{2}(\omega, r) = -\frac{\omega \beta_{2}^{*} \chi_{2} (1-R) I_{S} \widetilde{f}(\omega) \widetilde{H}(\omega \sin \theta / c_{l2})}{\kappa_{2} c_{l2}} \times \frac{\exp(i\omega r / c_{l2})^{*}}{4\pi r} [\widetilde{g}(i\omega \cos \theta / c_{l2}) - V(\theta) \widetilde{g}(-i\omega \cos \theta / c_{l2})].$$
(14)

Между тем единственное слагаемое в формуле (10) для косвенной регистрации определяется, напротив, теплопроводностью в поглощающей среде. Следовательно, при фокусированном приеме косвенная и непосредственная регистрации дополняют друг друга. Планарное разрешение оптических неоднородностей в конфокальном оптико-акустическом микроскопе может быть сопоставимо с размером пятна греющего излучения и коррелирует с разрешением в оптической микроскопии. Однако при острой фокусировке оптического излучения локальный нагрев поверхности может оказаться недопустимо велик и привести к повреждению поверхности или разрушению образца. Это условие является естественным ограничителем уровня сигнала (а значит, и предельной разрешающей способности оптико-акустического микроскопа).

При оценке максимального нагрева поверхности на различных частотах, исходя из решения системы (1)—(6), получаем

$$T_{\max} = W_0 \tilde{f}(\omega) / (2 \sqrt{\pi} \varkappa_2 a), \ \omega \ll \chi_2 / a^2,$$

$$\tilde{T}_{\max} = W_0 \tilde{f}(\omega) / (2 \sqrt{\pi} \varkappa_2 a) \sqrt{4\chi_2 / (-i\omega\pi a^2)}, \ \chi_2 / a^2 \ll \omega \ll a^2 \chi_2,$$

$$\tilde{T}_{\max} = W_0 \tilde{f}(\omega) a / (-\varkappa_2 \pi a^2 i \omega / \chi_2), \ a^2 \chi_2 \ll \omega.$$

Нагрев максимален на низких частотах, а так как переменная составляющая поглощаемой мощности не превышает ее среднего значения, то средний нагрев (при $\omega \rightarrow 0$) будет определять максимальную температуру поверхности. Считая $f(\omega=0)=1$, найдем

$$\bar{T}_{\max} = W_0 / (2 \sqrt{\pi} \varkappa_2 a). \tag{15}$$

Из (15) следует, что с уменьшением a для предотвращения разрушения исследуемой поверхности необходимо уменьшать мощность греющего излучения. Это в свою очередь уменьшает амплитуду оптико-акустического сигнала. Поэтому, задавая минимальное допустимое значение отношения «сигнал/шум» $(S/N)_{min}$, можно оценить возможное предельное разрешение a_{min} .

Косвенная регистрация

Исходя из формулы (10), принимая α =const и учитывая (15), получим выражение для отношения «сигнал/шум»:

$$(S/N) = \rho_1 \beta_1 T_{\max} \sqrt{4\pi \chi_1 \chi_2} \sqrt{\nu/\Delta \nu} |1 - i \sqrt{i\nu/\nu_T}|^{-1} \times (\sqrt{2k_p^2 \pi \epsilon_0 \varepsilon/(k_B T h)}/k_N) \pi c_{l1} F (2\pi a \nu/c_{l1}),$$
(16)

тде

$$F(x) = \exp(-x^2) \int_{0}^{x} \exp(\xi^2) d\xi$$
 (17)

— интеграл Досона, достигающий максимума при $x \approx 0.92$; в случае $x \ll 1$ функция $F(x) \approx x$.

В (16) проведено интегрирование по поверхности приемника в соответствии с днаграммой излучения (10) и введены обозначения: v рабочая частота, $\Delta v -$ полоса регистрируемых частот, $v_T = a^2 \chi/2\pi$, $2\pi \varepsilon_0 \epsilon r^2/h -$ емкость приемника, $k_p -$ его чувствительность, $k_B -$ постоянная Больцмана, $k_N -$ коэффициент шума усилителя, приведенный к его входу (примем $k_N = 3$). Расчет проведен для наиболее подходящих в этом случае емкостных микрофонов; величину $Q = v/\Delta v$ будем считать постоянной и равной по порядку величины $10^4 + 10^6$.

Максимум отношения «сигнал/шум» достигается в (16) при v= =v_m≈ c₁₁/2ла. Для обеспечения высокого разрешения необходимо использовать высокие частоты; так, фокусировке a=1 мкм соответствует $v_m=10^8$ Гц. Такие частоты не могут эффективно регистрироваться микрофонами. Поэтому мы оценим наилучшее разрешение a_{\min} на удобной для регистрации частоте v=200 кГц, ограничиваясь минимально допустимым отношением $(S/N)_{\min}=10$. Так как при этом $v\ll v_1==\alpha c_{l_1}/2\pi$, то

$$(S/N) = \rho_1 \beta_1 T_{\max} \sqrt{4\pi \chi_1 \chi_2} \sqrt{2k_o^2 \pi \epsilon_0 \epsilon Q/(k_B T h)} av/2k_N.$$
(18)

Задавая $T_{\max} = 1$ °С и принимая $\rho_1 = 1,3$ кг/м³, $\chi_1 = 10^{-5}$ м²/с, $\chi_2 = 10^{-5} \div 10^{-4}$ м²/с, $\beta_1 = 3,4 \cdot 10^{-3}$ K⁻¹, $k_p = 10^{-2}$ В/Па, $\epsilon = 12$, $h = 10^{-5}$ м, получаем из (18): $a_{\min} = (0,6 \div 6)$ мкм. Таким образом, при косвенной регистрации разрешение конфокального оптико-акустического микроскопа может достигать микронного уровня уже при доступных частотах модуляции. Если же ослабить требования на максимальный нагрев поверхности, то возможно достижение и более высокого разрешения, которое будет ограничиваться только остротой фокусировки греющего излучения.

Непосредственная регистрация

Пусть приемник имеет вид сферического сегмента, изготовленного из пьезоматериала, акустически идеально согласованного со средой и работающего в режиме холостого хода на частоте толщинного резонанса ($h=c_{13}/2\nu$, где c_{13} — скорость звука в материале пьезоэлемента, h — его толщина). Исходя из формулы (14) с учетом (15), считая α =const и используя выражение для уровня шумов преобразователя [11], отношение «сигнал/шум» может быть выражено следующим образом:

$$(S/N) = \beta_2^* \chi_2 T_{\max} h_{33} (k_N c_{12})^{-1} \sqrt{2\pi \epsilon_0 \epsilon_{33}/(k_B T \operatorname{tg} \delta c_{13} \Delta v)} \times \\ \times \langle | (1 + iv \cos \theta/v_a)^{-1} - V(\theta) (1 - iv \cos \theta/v_a)^{-1} | \times \\ \times av \exp \{-(2\pi av \sin \theta/c_{12})^2\} \rangle,$$
(19)

где $v_a = \alpha c_{l2}/2\pi$, h_{33} — пьезомодуль, tg δ — тангенс угла полных потерь пьезопреобразователя, ε_{33} — диэлектрическая проницаемость материала пьезоэлемента, а $\langle ... \rangle$ означает усреднение по апертуре преобразователя.

При низкой частоте модуляции $v \ll v_a$ выражение (19) значительно упрощается:

$$(S/N) = \beta_2^* \chi_2 T_{\max} h_{33} (k_N c_{l2})^{-1} \langle (1 - V(\theta)) \rangle \times \times a_V \sqrt{2\pi \varepsilon_0 \varepsilon_{33} / (k_B T \operatorname{tg} \delta c_{l3} \Delta \nu)},$$
(20)

т. е. отношение «сигнал/шум» линейно возрастает с увеличением частоты. При $v \gg v_a$ отношение «сигнал/шум» (19) убывает с частотой быстрее, чем v^{-1} . Таким образом, отношение «сигнал/шум» (19) имеет максимум, который достигается при $v_m \approx v_a$. Так же как и при косвенной регистрации, эти частоты слишком велики, и нас интересуют более низкие частоты, удобные для регистрации и слабо затухающие при распространении.

при распространения. Оценим a_{\min} на рабочей частоте v = 5 МГц. При этом можно воспользоваться выражением (20). Задавая $T_{\max} = 1$ °С, $(S/N)_{\min} = 10$, принимая $\langle 1 - V(\theta) \rangle = 0,3$, $\varepsilon_{33} = 10^3$, $c_{12} = 4 \cdot 10^3$ м/с, $\Delta v = 1$ Гц, tg $\delta = 0,1$, $k_N = 3$, $\chi_2 = 10^{-4}$ м²/с, $c_{12} = 5 \cdot 10^3$ м/с, $\beta_2 = 10^{-5}$ К⁻¹, получим из (20) $a_{\min} = 0,5$ мкм. Таким образом, даже вдали от оптимальных частот можно. достичь микронного разрешения, которое будет ограничиваться остротой фокусировки греющего излучения.

Разрешение неоднородностей по глубине при непосредственной регистрации определяется сомножителем $[\widehat{g}(i\omega\cos\theta/c_{l_2})-V(\theta)\widehat{g}(-i\omega\times\cos\theta/c_{l_2})]$ в (14), т. е. длиной акустической волны, и поэтому достижение высокого разрешения в данной схеме регистрации не представляется возможным. Более целесообразно в этом случае использовать косвенную регистрацию: разрешение по глубине будет определяться длиной тепловой волны (сомножителем $\widehat{g}(-i\sqrt{i\omega/\lambda_2}))$ и для достижимых практически частот модуляции также может составлять доли микрона. Разрешение, вообще говоря, не ограничивается остротой фокусировки греющего излучения.

Подведем некоторые итоги. В работе предложена и теоретически проанализирована схема конфокального оптико-акустического микроскопа (КОАМ), сочетающая в себе преимущества оптического и акустического микроскопов: высокую разрешающую способность в доли микрона и возможность ее достижения на технически легкодоступных частотах ультразвука v=10⁵ ÷ 10⁷ Гц. Изображение КОАМ при косвенной регистрации определяется в основном теплообменом на поверхности, а при непосредственной регистрации — тепловым расширением исследуемой среды. Предельное разрешение КОАМ, ограничиваемое допустимым перегревом поверхности, может достигать долей микрона как при непосредственной, так и при косвенной регистрации. Для получения высокого разрешения по глубине исследуемой среды выгоднее использовать косвенную регистрацию сигнала, а для выделения оптических неоднородностей — непосредственную. Сочетание непосредственной и косвенной схем регистрации позволит отделить неоднородности тепловых свойств объекта и коэффициента поглощения света. Изменение частоты модуляции при косвенной регистрации дает возможность осуществить трехмерную томографию приповерхностных неоднородностей.

Полученные результаты позволяют говорить о КОАМ как о перспективном средстве неразрушающего контроля и диагностики свойств материалов.

Авторы выражают свою глубокую благодарность Н. Б. Подымовой за ценные замечания и помощь в подготовке статьи к печати.

ЛИТЕРАТУРА

[1] Rosencwaig A. Photoacoustics and Photoacoustic Spectroscopy. N. Y., 1980. [2] Thomas R. L., Favro L. D., Kuo P. K.//Can. J. Phys. 1986. 64. P. 1234. [3] Жаров В. П., Летохов В. С. Лазерная оптико-акустическая спектроскопия. М., 1984. [4] Busse G.//Phys. Acoust./Ed. W. Mason. 1988. 18. P. 403. [5] Вепnett S. D., Khury-Yakub B. T., Kino G. S., Liang K. K.//Trans. Son. Ultrason. 1985. N 2. P. 266. [6] Гусев В. Э., Карабутов А. А. Лазерная оптоакустика. М., 1991. [7] Карабутов А. А., Уваров А. В.//Вестн. Моск. ун-та. Физ. Астрон. 1988. 29, № 5. С. 64. [8] Лямшев Л. М., Челноков Б. И.//Акуст. журн. 1983. 29, № 3. С. 372. [9] Коломенский А. А.//Акуст. журн. 1988. 34, № 5. С. 871. [10] Rose L. R. F.//J. Асоизt. Soc. Ат. 1984. 75, N 3. P. 723. [11] Аронов Б. С. Электромеханические преобразователи из пьезоэлектрической керамики. Л., 1990. С. 32.

Поступила в редакцию 10.12.93